**Васильев, Алексей Леонидович. Методы и средства моделирования и оценки радиационной стойкости микросхем флэш памяти : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.05 / Васильев Алексей Леонидович; [Место защиты: Нац. исслед. ядерный ун-т].- Москва, 2010.- 142 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/1668**